

жений Дебая-Валлера L_H [4]. Его получают из измерений зависимости интенсивности динамического пика ТРС-кривой от γ [3]. Результаты приведены в таблице, из которой видно, что степень разупорядочения решетки кристалла 2 выше, чем кристалла 1.

Детальная рентгendifрактометрическая оценка структурного совершенства исследованных кристаллов $CdTe$ свидетельствует о том, что их кристаллическая структура находится на уровне, характерном для соединений $A^{III}B^V$. Из них могут быть изготовлены подложки размером $\geq 5 \text{ см}^2$, не содержащие таких дефектов, как малоугловые границы, двойники, макронапряжения. На лучших образцах количественные характеристики кривых качания (ω, P, R_i^2) близки к теоретическим значениям для динамической теории рассеяния рентгеновских лучей. Таким образом, трудности с использованием теллурида кадмия в качестве подложечного материала [5] имеют причины исключительно технологического характера.

Л и т е р а т у р а

- [1] D i n a n J.H., Q a d r i S.B. - J. Vac. Sci. Technol., 1986, v. A4, N4, p. 2158-61.
- [2] S a s s e n b e r g U., B e r g e r H., E n g e l A. - Cryst. Res. Technol., 1987, v. 22, N 5, p. K86-87.
- [3] К о в ъ е в Э.К., Р а т н и к о в В.В., С о р о к и н Л.М. ФТТ, 1981, т. 23, № 6, с. 1626-1629.
- [4] К р и в о г л а з М.А. Дифракция рентгеновских лучей и нейtronов в неидеальных кристаллах, Киев: Наукова думка, 1983. 408 с.
- [5] F a r r o w R.F.C. - J. Vac. Sci. Technol., 1985, v. A3, N 1, p. 60-66.

Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе
АН СССР, Ленинград

Поступило в Редакцию
17 мая 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 15 12 августа 1988 г.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ВОЗБУЖДАЕМОГО ПРОТОНАМИ В УСЛОВИЯХ ОСЕВОГО КАНАЛИРОВАНИЯ

В.П. П е т у х о в, А.М. Б о р и с о в,
Н.Г. Г о р я г а, Е.А. Р о м а н о в с к и й

Исследование поляризации характеристического рентгеновского излучения, возбуждаемого ускоренными ионами в монокристаллах,

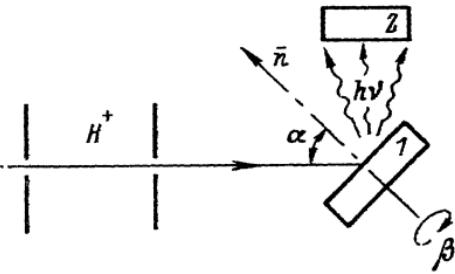
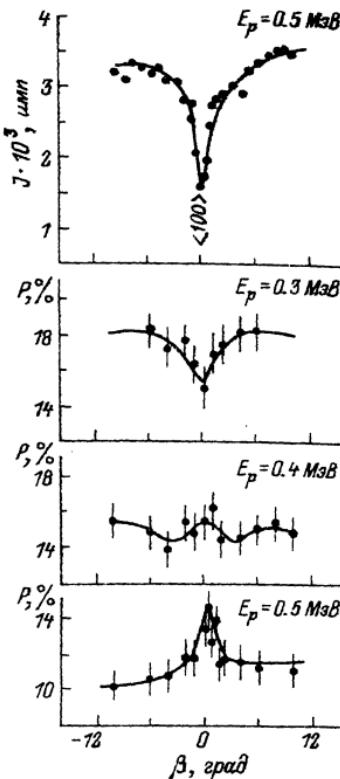


Рис. 1. Схема эксперимента.
1 — мишень, 2 — спектрометр-
поляриметр.

Рис. 2. Зависимость интенсив-
ности J и степени поляриза-
ции P излучения L_L линии
атома серебра, возбуждаемого
протонами от азимутального
угла β поворота мишени. Ли-
ния дана для наглядности.



представляет интерес в связи с тем, что особенности поведения степени поляризации отдельных линий рентгеновского спектра в зависимости от ориентации монокристалла и энергии ионов могут нести богатую информацию о закономерностях движения ионов в монокристалле, которую не всегда можно извлечь из экспериментов, в которых регистрируются либо обратное рассеяние частиц, либо выход рентгеновского излучения [1]. Теоретические оценки [2] показывают, что поляризация излучения, возбуждаемого протонами в условиях канализирования, может отличаться от значений поляризации при случайной ориентации монокристалла относительно пучка ионов, однако экспериментальные исследования в этом направлении пока отсутствуют. В данной работе впервые экспериментально обнаружена ориентационная и энергетическая зависимость поляризации характеристического рентгеновского излучения, возбуждаемого протонами в условиях осевого канализирования в монокристалле серебра.

На установке, состоящей из дифракционного спектрометра-поляриметра, выполненного по схеме Соллера, и двухосного гониометра мишени, проведены измерения зависимости поляризации излучения L_L — линии серебра от ориентации монокристалла относительно оси пучка протонов. Энергия протонов изменялась в диапазоне от 0.3 до 0.5 МэВ. Угловое расхождение пучка протонов не превышало 0.2° . Рентгеновский спектрометр имеет разрешение ~ 30 эВ при энергии квантов 3 кэВ. Мишенью служил монокристалл серебра.

(диаметр ~ 10 мм, толщина ~ 5 мм) с плоскостью среза близкой к кристаллографической плоскости (110). Кристалл ориентирован так, что при угле падения протонов на мишень $\alpha = 52^\circ$, отсчитываемом от нормали к ее поверхности, и азимутальном угле поворота мишени $\beta = 0^\circ$, ось протонного пучка параллельна кристаллографической оси $\langle 100 \rangle$. Рентгеновское излучение регистрировалось под углом 90° к протонному пучку в плоскости его падения на мишень (рис. 1). Для исключения систематической ошибки в измерениях поляризации, обусловленной погрешностями в юстировке прибора, одновременно с измерением интенсивности L_1 -линии измерялась интенсивность L_B -линии, излучение которой неполяризовано. При определении степени поляризации L_1 -линии ее интенсивность нормировалась на интенсивность L_B -линии.

Результаты измерений зависимости интенсивности L_1 -линии J и ее степени поляризации P от азимутального угла β поворота монокристалла приведены на рисунке 2. Во всем диапазоне исследованных энергий протонов зависимость $J(\beta)$ имеет вид „лунки“ с минимумом при $\beta = 0^\circ$, когда ось пучка и кристаллографическая ось $\langle 100 \rangle$ совпадают. Этот минимум выхода объясняется тем, что при такой ориентации часть протонного пучка, движущаяся в монокристалле близко к оси цепочки атомов и испытывающая меньшие тормозные потери, возбуждает рентгеновское излучение на больших расстояниях от поверхности, что приводит к уменьшению выхода излучения из монокристалла за счет самопоглощения в материале мишени. Кроме того, при движении протонов в условиях канализования уменьшается вероятность ионизации внутренних оболочек, т.к. столкновения происходят при больших параметрах удара, что также приводит к уменьшению выхода рентгеновского излучения. В то же время, как можно видеть из рисунка, степень поляризации L_1 -излучения атомов серебра в зависимости от азимутального угла при разных энергиях протонов ведет себя существенно по-разному. По-видимому, в зависимости от энергии меняется вклад в излучение от разных процессов, определяющих столкновения, сопровождающиеся ионизацией внутренней оболочки атомов цепочки, вдоль которой движется поток протонов и, следовательно, поляризация излучения. Степень поляризации L_1 -линии атомов серебра зависит от энергии протонов и уменьшается от 29 до 8% при изменении энергии от 0.15 до 0.5 МэВ [3]. Поэтому при измерениях на толстой мишени регистрируемая степень поляризации возрастает по сравнению с тонкой мишенью, т.к. при этом поляризация определяется не только излучением от протонов с начальной энергией падающего пучка, но и от протонов с меньшей энергией, заторможенных внутри мишени. При возбуждении рентгеновского излучения протонами, двигающимися в монокристалле в условиях канализования, вклад в измеряемую поляризацию вносят как канализированные, так и деканализированные частицы. Возрастание степени поляризации L_1 -линии при $\beta = 0^\circ$ по сравнению со случайной ориентацией кристалла ($\alpha = 4.5^\circ$) в случае, когда энергия протонов $E_p = 0.5$ МэВ, может быть, обусловлено излучением, возбуждаемым деканализирован-

ными частицами, т.к. канализированные протоны, движущиеся вблизи оси (что соответствует большим значениям прицельного параметра), с меньшей вероятностью ионизуют внутренние оболочки, и их вклад в общее излучение мал. После того, как эти протоны теряют часть энергии и выходят из канала, они уже возбуждают излучение с поляризацией, соответствующей этой меньшей энергии протонов, а с уменьшением энергии частиц поляризация возрастает. В случае $E_p = 0.3$ МэВ, уменьшение поляризации при $\beta = 0^\circ$ связано, возможно, с тем, что основной вклад в излучение дают именно канализированные частицы, для которых реализуются столкновения с большими прицельными параметрами. А из расчетов [4] следует, что степень поляризации L_z -линий должна уменьшаться с увеличением прицельного параметра. Поведение степени поляризации в зависимости от ориентации монокристалла при энергии протонов 0.4 МэВ, видимо, соответствует промежуточному случаю, когда работают оба механизма.

На данном этапе мы вынуждены ограничиться только лишь качественными соображениями по поводу наблюдаемого явления, т.к. полное понимание процессов, сопровождающих ионизацию и выстравивание вакансий во внутренних оболочках атома в условиях канализирования, возможно только после проведения детальных расчетов и дополнительных экспериментов. Однако сейчас уже понятно, что поляризация излучения, возбуждаемого в ионно-атомных столкновениях, чувствительна к динамике установления режима канализирования ионов в кристаллах и к распределению потока частиц, движущихся в кристалле. А эта информация важна, в частности, для понимания процессов ионного легирования и при разработке методов пучковой диагностики кристаллов.

Авторы благодарят Н.В. Личкову и С.Ф. Мусихину за изготовление монокристалла серебра, В.С. Куликаускаса за помощь в работе с кристаллами, а также Н.М. Кабачника за полезное обсуждение полученных результатов.

Л и т е р а т у р а

- [1] К а б а ч н и к N.M. et al. - Phys. St. Sol., 1987, B139, p. 17-57.
- [2] V o r o b j e v N.F., P e t u k h o v V.P., K a b a c h n i k N.M. - Nucl. Instrum. and Meth., 1984, v. 32, p. 316-317.
- [3] П е т у х о в В.П., Р о м а н о в с к и й Е.А., Е р м а к о в С.В. - Письма в ЖЭТФ, 1979, т. 29, с. 385-387.
- [4] Е р е м и н Н.В., К а б а ч н и к Н.М., К о н д р а т ь е в В.Н. - Материалы ХУ1 Всесоюзного совещания по взаимо-

действию заряженных частиц с кристаллами. Москва,
1987, с. 84-86.

Научно-исследовательский институт
ядерной физики
при Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова

Поступило в Редакцию
16 октября 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 15

12 августа 1988 г.

ЯДЕРНЫЙ ГАММА-РЕЗОНАНС
В ОБЛУЧЕННОМ НЕЙТРОНАМИ АМОРФНОМ
СПЛАВЕ $Fe_{80}B_{20}$

С.М. Ч е р е м и с и н, А.Ю. Д у д к и н

Один из путей исследования аморфных металлических сплавов (АС) – сопоставление структурно-чувствительных характеристик материалов, полученных различными способами (закалка из расплава, вакуумное осаждение, ионная имплантация и др.), а также модифицированных механическими, термическими и радиационными воздействиями [1, 2]. Радиационные свойства АС представляют самостоятельный интерес и в настоящее время интенсивно изучаются [3, 4].

В настоящей работе измерены спектры ядерного гамма-резонанса (ЯГР) ^{57}Fe образцов АС $Fe_{80}B_{20}$, облученных в канале реактора при температуре ≤ 80 °С флюенсами $\Phi = 1.3 \cdot 10^{16}$ – $3 \cdot 10^{19}$ нейтр./ cm^2 (тепловых), и таких же образцов, подвергнутых отжигу при различных температурах. Все образцы были вырезаны из одного однородного отрезка (150x10x0.025 мм) ленты, полученной закалкой из расплава.

Результаты измерений представлены на рисунке. В процессе облучения среднее магнитное поле H на ядрах ^{57}Fe возрастает на $\approx 3\%$, ширина и асимметрия [5] линий спектра ЯГР практически не изменяются. Такое возрастание H обычно свидетельствует о релаксации аморфной структуры, переходе ее в состояние с меньшей свободной энергией [6, 7]. Признаков кристаллизации сплава на спектрах ЯГР облученных образцов не наблюдалось.

Поскольку процесс термической структурной релаксации сильно зависит от условий закалки и исходного состояния АС [8], результаты можно сопоставлять только в пределах одной партии, а лучше одного отрезка ленты. Это обстоятельство заставило провести измерения, аналогичные [6, 7], с целью определения максимального возрастания H в процессе термической структурной релаксации.

Отжиг образцов проводился в различных сочетаниях времени и температуры, при этом максимальное возрастание H не превышало 1.2%. Данные рис. 1 соответствуют началу ($\approx 5\%$) кристаллизации